



Рис. 2. Зависимость плотности островков  $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$  от температуры осаждения при различной длительности осаждения: 1 – 180 с; 2 – 300 с; 3 – 420 с

Fig. 2. Dependence of the density of  $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$  islands on the deposition temperature at different deposition times:  
1 – 180 s; 2 – 300 s; 3 – 420 s